

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Krystaliczny kontroler do pomiaru grubości nakładanej warstwy o średnicy: 12,5 mm

Przedmiot zamówienia stanowią akcesoria do mikroskopu skaningowego Nova Nano Sem450 w postaci zużywalnej części do napyłarki, która pozwala na pomiar grubości nałożonej warstwy na próbkę.

W projekcie Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - płacone ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/2575 z dnia 20.10.2022, Działanie nr 7 ISKRA niezbędne staje się przygotowanie odpowiednie próbek polimerowych w postaci nałożenia o odpowiedniej grubości warstwy z metalu lekkiego. Taki pomiar jest wymagany do odpowiedniego obrazowania próbek za pomocą mikroskopii skaningowej.